日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2002年12月 9日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-356800

[ST. 10/C]:

[JP2002-356800]

出 願 人 Applicant(s):

矢崎総業株式会社

2003年10月31日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



【書類名】 特許願

【整理番号】 YZK-6030

【提出日】 平成14年12月 9日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H05K 3/34

【発明の名称】 電子部品の実装構造

【請求項の数】 7

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県榛原郡榛原町布引原206-1 矢崎部品株式会

社内

【氏名】 鈴木 雅孝

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県榛原郡榛原町布引原206-1 矢崎部品株式会

社内

【氏名】 荒深 貴幸

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県榛原郡榛原町布引原206-1 矢崎部品株式会

社内

【氏名】 鈴木 浩江

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県榛原郡榛原町布引原206-1 矢崎部品株式会

社内

【氏名】 岩田 智之

【特許出願人】

【識別番号】 000006895

【氏名又は名称】 矢崎総業株式会社

【代表者】 矢崎 信二

【代理人】

【識別番号】 100083806

【弁理士】

【氏名又は名称】 三好 秀和

【電話番号】

03-3504-3075

【選任した代理人】

【識別番号】 100068342

【弁理士】

【氏名又は名称】 三好 保男

【選任した代理人】

【識別番号】 100100712

【弁理士】

【氏名又は名称】 岩▲崎▼ 幸邦

【選任した代理人】

【識別番号】 100087365

【弁理士】

【氏名又は名称】 栗原 彰

【選任した代理人】

【識別番号】 100100929

【弁理士】

【氏名又は名称】 川又 澄雄

【選任した代理人】

【識別番号】

100095500

【弁理士】

【氏名又は名称】 伊藤 正和

【選任した代理人】

【識別番号】 100101247

【弁理士】

【氏名又は名称】 高橋 俊一

【選任した代理人】

【識別番号】

100098327

【弁理士】

【氏名又は名称】 高松 俊雄

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

特願2001-376848

【出願日】

平成13年12月11日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001982

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9708734

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 電子部品の実装構造

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一方の表面を部品搭載面とし、他方の表面をはんだ浸漬面とした配線基板における前記一方又は両方の表面に配線パターンが形成されると共に、前記配線基板の両面側に貫通して前記配線パターンのどちらか一方又は両方に電気的に接続されるスルーホールが形成され、該スルーホールに前記部品搭載面側より電子部品のリード部が挿入された状態で、前記スルーホール内ではんだを介して電気的に接続された電子部品の実装構造であって、

前記配線パターンに接続され、且つ前記配線基板の両面側に亘って貫通する熱 伝導部材を、前記スルーホールの近傍に設けたことを特徴とする電子部品の実装 構造。

【請求項2】 請求項1記載の電子部品の実装構造であって、

前記熱伝導部材における前記はんだ浸漬面側の端部に、該はんだ浸漬面に沿って、金属材料でなる集熱部が延設されていることを特徴とする電子部品の実装構造。

【請求項3】 請求項2記載の電子部品の実装構造であって、

前記集熱部は、前記はんだ浸漬面側の前記スルーホールの端部に電気的に接続されていることを特徴とする電子部品の実装構造。

【請求項4】 請求項1乃至請求項3のいずれか一項に記載された電子部品の実装構造であって、

前記熱伝導部材(14)は、バイアホール(14)であることを特徴とする電子部品の実装構造。

【請求項5】 請求項4記載の電子部品の実装構造であって、

前記スルーホール(11)の近傍に設けられた前記バイアホール(14)が単数であり、前記バイアホール(14)の内壁面と前記スルーホール(11)の内壁面との最短距離Lが、 $0.5\,\mathrm{mm} \le L \le 3\,\mathrm{mm}$ であることを特徴とする電子部品の実装構造。

【請求項6】 請求項4記載の電子部品の実装構造であって、

前記スルーホール(11)の近傍に設けられた前記バイアホール(14)は、前記配線パターン(13)の幅方向に並ぶ一対であり、これらバイアホール(14)における前記スルーホール(11)側に位置する内壁面を結ぶ線と前記スルーホール(11)の内壁面との最短距離しが、 $0.5 \,\mathrm{mm} \leq L \leq 3 \,\mathrm{mm}$ であることを特徴とする電子部品の実装構造。

【請求項7】 請求項4記載の電子部品の実装構造であって、

前記スルーホール(11)の近傍に設けられた前記バイアホール(14)は、前記配線パターン(13)の長さ方向に並ぶ一対であり、これらバイアホール(14)のそれぞれのスルーホール(11)側に最も近い内壁面同士の中央の位置と前記スルーホール(11)の内壁面との最短距離しが、 $0.5 \,\mathrm{mm} \leq L \leq 3 \,\mathrm{m}$ mであることを特徴とする電子部品の実装構造。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1\]$

【発明の属する技術分野】

本発明は電子部品の実装構造に関し、さらに詳しくは、プリント配線基板のスルーホールに挿入された電子部品のリード部をはんだ付けする構造に関する。

[0002]

【従来の技術】

従来、プリント配線基板のスルーホールに電子部品のリード部を挿入した状態ではんだを用いて電気的に接続した実装構造としては、図8に示すようなものがある。この実装構造では、図8に示すように、プリント配線基板1は、上面が部品搭載面1aとされ、下面がはんだ浸漬面1bとされ、プリント配線基板1の適所には上下両面側に貫通する導電性材料でなるスルーホール2が設けられている。このスルーホール2の上端部は、部品搭載面1aに形成された配線部3に接続されている。また、プリント配線基板1の部品搭載面1aには、この他に例えば面実装型の電子部品9がはんだ付けによって搭載されている。さらに、スルーホール2の下端部の周囲には、スルーホール2から延設されたランド部4が形成されている。このランド部4は、図8に示すように裏面(はんだ浸漬面)側の配線パターン5に接続されている場合もある。

[0003]

上記したプリント配線基板1にリード部6 a を備えた電子部品6をはんだ付けするには、リード部6 a をプリント配線基板1の部品搭載面1 a 側からスルーホール2に挿入し、フローはんだ付け装置や浸漬はんだ漕にて、プリント配線基板1のはんだ浸漬面1 b 側から溶融されたはんだ7に付着させる。すると、溶融されたはんだ7がスルーホール2内に入り込むと共に、スルーホール2を介してプリント配線基板1の部品搭載面1 a 側に熱が伝達される。このようにしてスルーホール2内を上昇したはんだ7がフィレット形状を形成し、これが冷却固化されることによって図9に示すようなはんだフィレットが形成される。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

ところで、はんだ7として鉛フリーはんだ(SnベースにAg, Cu, Bi等を $1 \sim 3$ 種類添加した合金)を使用した場合には、融点がSn/Pb 共晶はんだ(183°C)に比べて高くなるものが多い。例えば、Sn/Ag3. 5 の場合には融点が21?C、Sn/Ag3. 5 の場合には融点が21?C、Sn/Ag3. 0/Cu0. 5 の場合には融点が218°C、Sn/Ag3. 0/Cu0. 7/Bi3. 0 の場合には融点が211°Cである。そして、プリント配線基板 1 や電子部品 6 の耐熱性からはんだ付け温度は2600 C程度までしか上げることができず、融点とはんだ付け温度との間にわずかな温度差しか持たせることができない場合がある。すると、スルーホール2 内に入り込んだはんだ7がわずかな時間で融点まで温度低下するため、スルーホール2 の上部に入り込むはんだ7の濡れ性、広がり性が悪く、図10に示すように、スルーホール2の上部には良好なはんだフィレットが形成されずはんだ付け不良になるという問題がある。なお、図10 の仮想線は良好なはんだフィレット形状を示す。

[0005]

また、融点が一般的に低いSn/Pb共晶はんだを使用した場合には、融点とはんだ付け温度との間に適度の温度差を持たせることができるため、図9に示すような良好なはんだフィレットを形成できる。しかし、Sn/Pb共晶はんだを使用した場合にあっては、融点とはんだ付け温度との間にわずかな温度差しかな

い場合には同様の不具合が生じる。

[0006]

一方、S n/P b 共晶はんだを使用した場合にあって、はんだ接合部分に熱疲労ストレスが加わると、図11に示すように、はんだ7自身にクラック a が発生し、このクラック a が進行する。また、鉛フリーはんだを使用する場合には、S n/P b 共晶はんだに比べて合金強度が上がる場合が多く、はんだ7自身にクラックが入りにくい。しかし、はんだ7のクラックによる熱ストレスの解放がない分、その熱疲労ストレスがプリント配線基板1に作用し、図12に示すように、フィレットリフテング b や、スルーホール2と配線部3とが接合する部分(コーナー)のコーナークラック c や、配線部(ランド部)3とプリント配線基板1との間の剥離 d が発生する。このようにフィレットリフテング b やコーナークラック c や剥離 d が発生すると、電子部品6のリード部6 a とプリント配線基板1の部品搭載面1aの配線部4との間が接続不良になる。

[0007]

特に、熱疲労ストレスが大きくなる大型のリード部付きの電子部品6をはんだ付けする場合には、はんだ接合部分の信頼性が低下するため、鉛フリーはんだの使用が困難となる。また、Sn/Pb共晶はんだを使用した場合でも、ストレスが大きいときには同様の現象が発生し、電子部品6のリード部6aとプリント配線基板1の部品搭載面1aの配線部4との間が接続不良になる。

[0008]

そこで、本発明は、前記した課題を解決すべくなされたものであり、融点とは んだ付け温度との間にわずかな温度差しか持たせることができない場合にあって もはんだ付け不良を低減できる電子部品の実装構造を提供することを目的とする

[0009]

また、本発明は、熱疲労ストレスによりはんだのフィレットリフテングやスルーホール周りの配線部(ランド部)のクラックおよび剥離が発生しても電子部品のリード部と配線基板の部品搭載面の配線部との間の回路接続を確保できる電子部品の実装構造を提供することを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】

請求項1記載の発明は、一方の表面を部品搭載面とし、他方の表面をはんだ浸漬面とした配線基板における前記一方又は両方の表面に配線パターンが形成されると共に、前記配線基板の両面側に貫通して前記配線パターンのどちらか一方又は両方に電気的に接続されるスルーホールが形成され、該スルーホールに前記部品搭載面側より電子部品のリード部が挿入された状態で、前記スルーホール内ではんだを介して電気的に接続された電子部品の実装構造であって、前記配線パターンに接続され、且つ前記配線基板の両面側に亘って貫通する熱伝導部材を、前記スルーホールの近傍に設けたことを特徴とする。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

請求項1記載の発明では、電子部品のリード部を配線基板の部品搭載面側からスルーホールに挿入し、配線基板をフローはんだ付け装置や浸漬はんだ漕などを用いて、配線基板のはんだ浸漬面より溶融されたはんだがスルーホール内に入り込むようになっている。そして、配線基板のはんだ浸漬面より熱がスルーホール内のはんだを介して、または、スルーホールを介して配線基板の部品搭載面側に伝達される。加えて、はんだ浸漬面側の熱がスルーホール近傍の熱伝導部材を介して配線基板の部品搭載面側に伝達される。このため、部品搭載面側のスルーホール近傍の配線パターンが昇温され、スルーホールの部品搭載面側まで入り込んだはんだの温度低下を抑制して、はんだの濡れ性、広がり性を向上させる。従って、スルーホール上端部分に位置するはんだは、良好なフィレット形状を形成して冷却固化される。この発明では、スルーホールの構造やスルーホールに接続される配線パターンなどの変更を行わずにスルーホール部分のはんだ付けを良好にすることができる。

[0012]

請求項2記載の発明は、請求項1記載の電子部品の実装構造であって、前記熱 伝導部材における前記はんだ浸漬面側の端部に、該はんだ浸漬面に沿って、金属 材料でなる集熱部が延設されていることを特徴とする。

[0013]

請求項2記載の発明では、請求項1に記載された発明の作用に加え、はんだ浸 漬面側の熱が集熱部を介して直接に部品搭載面側のスルーホール近傍の配線パタ ーンに伝達される。従って、部品搭載面への熱供給が促進されるため、スルーホ ールとリード部との間に良好な形状のはんだフィレットを形成することができる

$[0\ 0\ 1\ 4]$

請求項3記載の発明は、請求項2記載の電子部品の実装構造であって、前記集 熱部は、前記はんだ浸漬面側の前記スルーホールの端部に電気的に接続されてい ることを特徴とする。

[0015]

請求項3記載の発明では、請求項2に記載された発明の作用に加え、配線基板のはんだ浸漬面側のスルーホールと部品搭載面の配線パターンとが熱伝導部の補助導電部を介して電気的に接続されているため、部品搭載面側のスルーホールと熱伝導部との間の配線パターンが破損した場合でも、電子部品のリード部と配線パターンとを、スルーホールおよび熱伝導部を介して電気的に接続することができる。

[0016]

請求項4記載の発明は、請求項1乃至請求項3のいずれか一項に記載された電子部品の実装構造であって、前記熱伝導部材は、バイアホールであることを特徴とする。

[0017]

請求項4記載の発明では、熱伝導部材がバイアホールであるため、配線基板にスルーホールを形成する工程で熱伝導部材を同時に形成することができる。

[0018]

請求項5記載の発明は、請求項4記載の電子部品の実装構造であって、前記スルーホールの近傍に設けられた前記バイアホールが単数であり、前記バイアホールの内壁面と前記スルーホールの内壁面との最短距離Lが、 $0.5 \, \mathrm{mm} \leq L \leq 3 \, \mathrm{mm}$ であることを特徴とする。

[0019]

請求項6記載の発明は、請求項4記載の電子部品の実装構造であって、前記スルーホールの近傍に設けられた前記バイアホールは、前記配線パターンの幅方向に並ぶ一対であり、これらバイアホールにおける前記スルーホール側に位置する内壁面を結ぶ線と前記スルーホールの内壁面との最短距離しが、0.5 mm≤L≤3 mmであることを特徴とする。

[0020]

請求項7記載の発明は、請求項4記載の電子部品の実装構造であって、前記スルーホールの近傍に設けられた前記バイアホールは、前記配線パターンの長さ方向に並ぶ一対であり、これらバイアホールのそれぞれのスルーホール側に最も近い内壁面同士の中央の位置と前記スルーホールの内壁面との最短距離しが、 $0.5 \, \mathrm{mm} \le L \le 3 \, \mathrm{mm}$ であることを特徴とする。

[0021]

請求項5~請求項7に記載された発明では、バイアホールをスルーホールから $0.5\,\mathrm{mm}$ より離した位置に形成すればよいため、スルーホールの上部に、挿入 されているリード部との間に形成されるはんだフィレットが形成される面が確保 できる。加えて、 $0.5\,\mathrm{mm} \le L \le 3\,\mathrm{mm}$ の範囲に位置設定することにより、スルーホールから浸み上がるはんだの広がり量(寸法)を大きくできることが確認 された。

[0022]

【発明の実施の形態】

以下、本発明に係る電子部品の実装構造の詳細を図面に示す実施形態に基づいて説明する。

[0023]

(第1実施形態)

図1および図2は本発明の第1実施形態を示している。なお、図1は電子部品をはんだ付けしたプリント配線基板の断面図、図2はプリント配線基板の要部拡大平面図である。

[0024]

図1および図2に示すように、プリント配線基板10は、上面が部品搭載面1

0 a であり、下面がはんだ浸漬面10bである。プリント配線基板10の所定の位置には、両面側に開口するスルーホール11が設けられている。スルーホール 11の部品搭載面10a側の端部は、部品搭載面10aに設けられた例えば銅でなる配線部(配線パターン)13に電気的に接続されている。

[0025]

また、各スルーホール11の近傍には、プリント配線基板10の両面側に亘って貫通する熱伝導部材14が設けられている。これら熱伝導部材14は、それぞれのスルーホール11が部品搭載面10a側で接続されている配線部13に連続して形成されている。熱伝導部材14は、スルーホール11と同様の形状に形成されている。また、熱伝導部材14の下端部の周縁には、高い熱伝導性材料でなる集熱部15が連続して設けられている。この集熱部15の部品搭載面10a側はランド部12や配線部13に接続されている。なお、本実施形態では、熱伝導部材14および集熱部15を、スルーホール11や配線部13と同じ金属材料で形成している。なお、熱伝導部材14は、通常、径寸法が0.5mm程度でよいため、配線部13の幅が狭い場合にも制約を受けることがない。

[0026]

上記したプリント配線基板10にリード部付きの電子部品16をはんだ付けするには、電子部品16のリード部16aをプリント配線基板10の部品搭載面10a側からスルーホール11に挿入する。そして、プリント配線基板10をフローはんだ付け装置や浸漬はんだ漕を用いて、プリント配線基板10のはんだ浸漬面10bより溶融されたはんだ17を供給する。すると、溶融されたはんだ17がスルーホール11内に入り込んで上昇すると共に、はんだ浸漬面10b側の熱がスルーホール11内のはんだ17およびスルーホール11を介してプリント配線基板10の部品搭載面10a側に伝達される。さらに、スルーホール11の近傍に配置されている熱伝導部材14は、はんだ浸漬面10b側の熱を部品搭載面10a側に伝達する。この結果、スルーホール11近傍の配線部13に熱が伝達されてプリント配線基板10の部品搭載面10a側が確実に所定のはんだ付け温度まで上昇させることができる。したがって、スルーホール11の部品搭載面10a側まで入り込んだはんだ17は冷えにくくなり、融点まで時間をかけて徐々

に冷却させることができる。このため、スルーホール11の部品搭載面10a側まで入り込んだはんだ17の濡れ性、広がり性が良く、はんだ17が良好なフィレット形状を形成して冷却固化される。

[0027]

したがって、融点とはんだ付け温度との間にわずかな温度差しか持たせることができない場合(例えばはんだ17として鉛フリーはんだを使用する場合)にあってもはんだ付け不良を低減できる。また、このようにはんだ17がフィレット形状を形成し、はんだ付け部分のはんだ量が増加するため、接続強度が増し、信頼性が向上する。

[0028]

また、熱容量の大きい電子部品16を搭載する場合や配線部13の幅が大きい場合には、部品搭載面10a側ではんだ17を確実にはんだ付け温度まで上昇させるために必要とする熱容量が大きくなるため、熱伝導部材14の数をそれに応じて増加することが好ましい。

[0029]

さらに、本実施形態では、熱伝導部材14のはんだ浸漬面側に集熱部15を設けているため、部品搭載面10a側の配線部13に熱を効率的に伝達できる。

[0030]

また、本実施形態では、集熱部15が、配線部13やスルーホール11と同一材料で形成されているため、集熱部15を配線部13およびスルーホール11と同じ製造工程中に作製することができるという利点がある。

[0031]

(第2実施形態)

図3は本発明の第2実施形態を示し、電子部品をはんだ付けしたプリント配線 基板の断面図である。なお、本実施形態において上記した第1実施形態と同一部 分には同一の符号を付して説明する。図3に示すように、この第2実施形態では 、熱伝導部材14のはんだ浸漬面側の端部の周縁に形成された集熱部15がスル ーホール11におけるはんだ浸漬面10b側の端部やはんだ浸漬面10b側の配 線部18に接続されている。

[0032]

この第2実施形態でも、プリント配線基板10にリード部付きの電子部品16 をはんだ付けするに際して、上記した第1実施形態と同様に、熱伝導部材14の作用によってプリント配線基板10の部品搭載面10a側が確実に温度上昇される。このため、はんだ17が良好なフィレット形状を形成し、融点とはんだ付け温度との間にわずかな温度差しか持たせることができない場合(例えばはんだ17として鉛フリーはんだを使用する場合)にあってもはんだ付け不良を低減できる。

[0033]

また、本実施形態では、集熱部15をはんだ浸漬面10b側のスルーホール11端部および配線部18に電気的に接続されているため、従来のように、熱ストレスによりはんだ17のフィレットリフテングやスルーホール11と配線部13との接合する部分のコーナークラックおよび剥離が発生しても電子部品16のリード部12とプリント配線基板10の部品搭載面10a側の配線部13との間の回路接続を熱伝導部14で確保できる。特に、熱疲労ストレスが大きくなる大型のリード部付きの電子部品をはんだ付けする場合には、はんだ接合部分の信頼性が低下するため、従来では鉛フリーはんだの使用が困難であったが、本発明によれば、熱疲労ストレスによりはんだ17のフィレットリフテングやランド部12のコーナークラック及び剥離が万一発生しても電子部品16のリード部16aとプリント配線基板10の部品搭載面10a側の配線部13との間の回路接続を確保できる。このため、大型のリード部付きの電子部品16を鉛フリーはんだを使用してはんだ付けすることが可能となる。

[0034]

また、熱伝導部材14の個数は、はんだ17のフィレットリフテングやランド部12のコーナークラックおよび剥離が発生して電子部品16のリード部16aと部品搭載面10a側のスルーホール11の端部とが断線しても配線上必要な電流を熱伝導部材14により通電可能な個数とする。そして、熱伝導部材14の径寸法は、通常0.5mm程度に形成されるが、それ以上の寸法でもよい。

[0035]

次に、バイアホール14が単数の場合(図4(a)参照)、バイアホール14が2つで横方向に(配線部の幅方向に)並んだ場合(図4(b)参照)、バイアホール14が2つで縦方向に(配線部の長さ方向に)並んだ場合(図4(c)参照)における、スルーホール11とバイアホール14との位置と、スルーホール11で浸み上がったはんだの横(部品搭載面)方向の広がり量(長さ:mm)との関係を実施例1~実施例3に基づいて説明する。

[0036]

(実施例1)

図4 (a) に示すように、スルーホール11と、熱伝導部材としてのバイアホール14を形成した配線基板を用意した。バイアホール14は、スルーホール11の部品搭載面側から延びるように形成された配線部13の幅方向の中央に配置されている。なお、図4(a)は、配線基板を部品搭載面側から見た状態を示す平面図である。

[0037]

この実施例1では、配線部13の幅寸法Wを1.0 mmとした。また、本実施例1では、スルーホール11の内壁面11Aとバイアホール14の内壁面14Aとの最短距離Lを0.4 mm~4.0 mmまで変えたものを用意し、下面側をはんだに浸漬して、部品搭載面側での広がり量(長さ)を測定した。

[0038]

この結果、図5に示すように、バイアホール14の内壁面14Aとスルーホール11の内壁面11Aとの最短距離L(図ではバイアホールの位置)が $0.5\,\mathrm{m}$ m以上で、且 $0.4\,\mathrm{m}$ m以下の範囲で、好ましくは、 $1.0\,\mathrm{m}$ m $0.2\,\mathrm{m}$ mの範囲ではんだの広がり量が良好となり($1.5\,\mathrm{5}\,\mathrm{m}$ m以上となり)、部品搭載面側に良好な形状のはんだフィレットを形成できることが判った。なお、配線部 $1.4\,\mathrm{m}$ 3の幅寸法を $1.4\,\mathrm{m}$ m まで増やしても同様の結果が得られた。

[0039]

(実施例2)

実施例2では、図4(b)に示すように、配線部13に幅方向に2つのバイアホール14を配置している。本実施例2においては、配線部13の幅2.0mm

として、2つのバイアホール14の内壁面14A同士を結ぶ線とスルーホール1 1の内壁面11Aとの最短距離Lを変えたものを用意し、配線基板の下面側をは んだに浸漬して、部品搭載面側でのはんだの広がり量(長さ)を測定した。

[0040]

この結果、図6に示すように、0.5 mm以上で且つ3.0 mm以下の範囲ではんだ広がり量が良好であることが判った。

[0041]

(実施例3)

[0042]

この結果、図7に示すように、最短距離Lが $1.0 \sim 3.0 \, \text{mm}$ の範囲ではんだの広がりが良好であることが判った。

[0043]

上記した実施例 $1 \sim$ 実施例 3 により、バイアホール 1 4 の位置がスルーホール 1 1 の近傍、特に $0.5 \leq L \leq 3.0$ の距離を満足する位置にあれば、はんだの広がりが良好となり、部品搭載面側に良好な形状のはんだフィレットを形成することができることが判る。また、バイアホール 1 4 がスルーホール 1 1 に対して、0.5 mmよりも近くすることは基板の製造品質上の点から一般に困難である。

[0044]

以上、第1実施形態、第2実施形態並びに実施例1~実施例3について説明したが、本発明はこれらに限定されるものではなく、構成の要旨に付随する各種の変更が可能である。

[0045]

例えば、上記した各実施形態では、熱伝導部材14をスルーホール11と同様 に管状に形成したが、熱伝導部材14の内側全部に高い熱伝導性をもつ導電性材 料を充填する構造としてもよい。

[0046]

【発明の効果】

以上説明したように、請求項1記載の発明によれば、電子部品のリード部が挿入、接続されるスルーホールの近傍に基板の両面側に亘って形成された熱伝導部材を備えるため、配線基板のはんだ浸漬面側の熱がスルーホールおよびその近傍の熱伝導部材を介して配線基板の部品搭載面側に伝達されて部品搭載面側が昇温されることからスルーホールの部品搭載面側まで入り込んだはんだの濡れ性、広がり性を向上させることができる。このため、はんだが良好なフィレット形状を形成した状態で冷却固化させることができる。したがって、融点とはんだ付け温度との間にわずかな温度差しか持たせることができない場合にあっても、はんだ付け不良を低減できる。

[0047]

請求項2の発明によれば、請求項1記載の発明の効果に加え、熱が集熱部材および熱伝導部材を介して部品搭載面側のランド部や配線部に伝達され、部品搭載面への熱供給が促進されるため、融点とはんだ付け温度との間にわずかな温度差しか持たせることができない場合であっても、はんだ温度の低下を抑制してはんだ付け不良を低減できる。

[0048]

請求項3の発明によれば、請求項2記載の発明の効果に加え、配線基板のはんだ浸漬面側のスルーホールが熱伝導部材の集熱部を介しても電気的に接続されるため、熱疲労ストレスによりはんだのフィレットリフテングやスルーホール上部のコーナークラックおよび剥離が発生しても電子部品のリード部と配線基板の部品搭載面の配線パターンとの間の回路接続を確保できる。

[0049]

請求項4記載の発明によれば、熱伝導部材がバイアホールであるため、配線基板にスルーホールを形成する工程で熱伝導部材を同時に形成することができる。

[0050]

請求項5~請求項7に記載された発明によれば、バイアホールをスルーホールから0.5 mmより離した位置に形成すればよいため、スルーホールの上部に、挿入されているリード部との間に形成されるはんだフィレットが形成されるはんだ広がり面が確保できる。加えて、0.5 mm \leq L \leq 3 mmの範囲に位置設定することにより、スルーホールから浸み上がるはんだの広がり量(寸法)を大きくできることが確認された。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1実施形態を示し、電子部品をはんだ付けしたプリント配線基板の 断面図である。

【図2】

本発明の第1実施形態を示し、プリント配線基板の要部拡大平面図である。

【図3】

本発明の第2実施形態を示し、電子部品をはんだ付けしたプリント配線基板の 断面図である。

【図4】

(a) は本発明に係る実施例1の概略平面図、(b) は実施例2の概略平面図 (c) は実施例3の概略平面図である。

図5

実施例1のバイアホールの位置とはんだ広がり量との関係を示すグラフである

【図6】

0

実施例2のバイアホールの位置とはんだ広がり量との関係を示すグラフである

【図7】

実施例3のバイアホールの位置とはんだ広がり量との関係を示すグラフである

【図8】

従来例を示し、電子部品をはんだ付けしたプリント配線基板の断面図である。

【図9】

良好なはんだ付け状態を示す要部拡大断面図である。

【図10】

良好でないはんだ付け状態を示す要部拡大断面図である。

【図11】

はんだ付けされたはんだにクラックが発生した状態を示す要部拡大断面図である。

【図12】

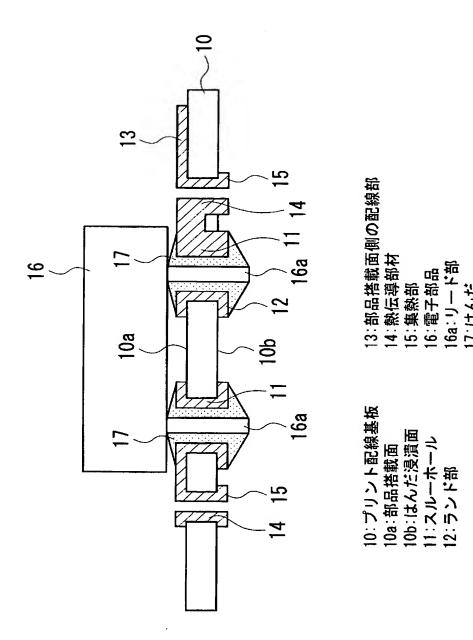
はんだ付けされたはんだ箇所にフィレットリフテング等が発生した状態を示す 要部拡大断面図である。

【符号の説明】

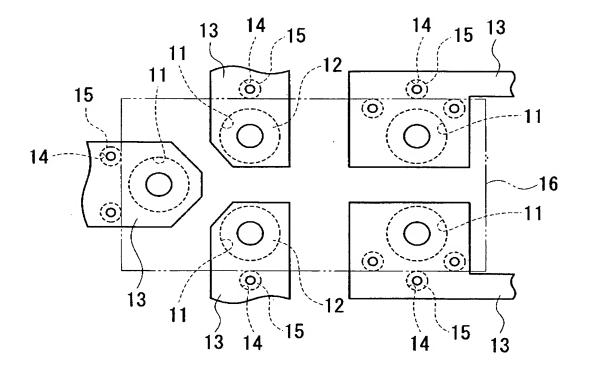
- 10 プリント配線基板(配線基板)
- 10a 部品搭載面
- 10b はんだ浸漬面
- 11 スルーホール
- 13 部品搭載面側の配線部
- 14 熱伝導部材
- 15 集熱部
- 16 電子部品
- 16a リード部
- 17 はんだ
- 18 はんだ浸漬面側の配線部

【書類名】 図面

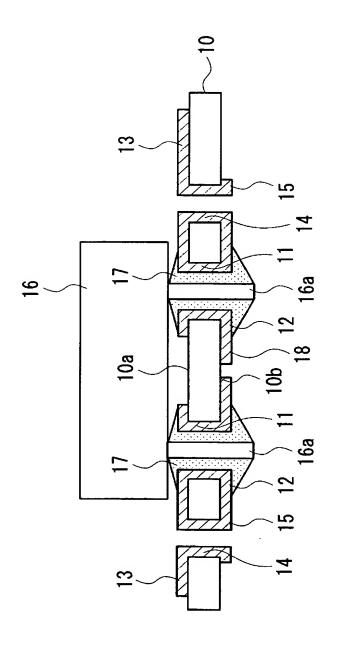
【図1】



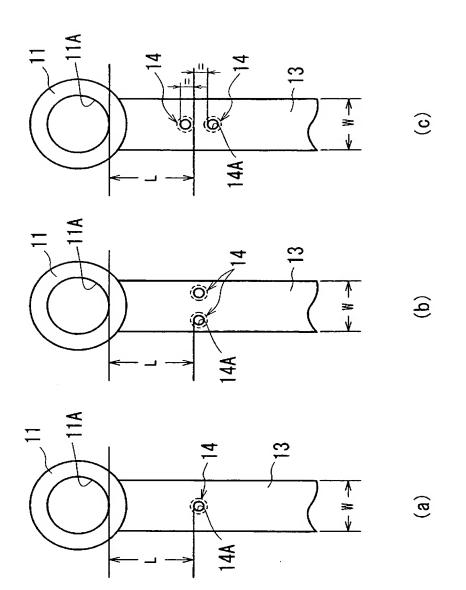
【図2】



【図3】

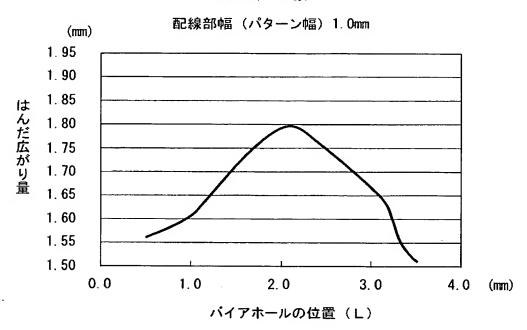


【図4】

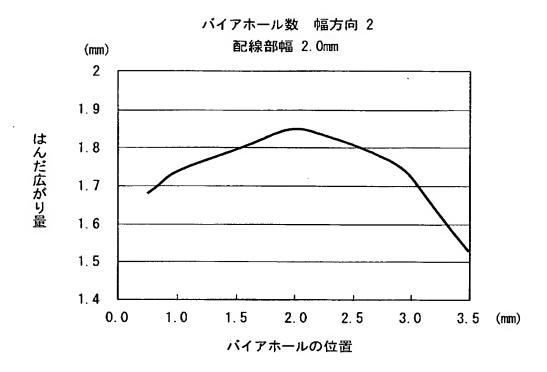


【図5】

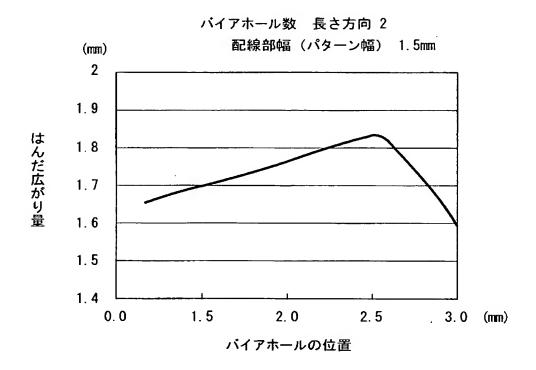
バイアホール数 1



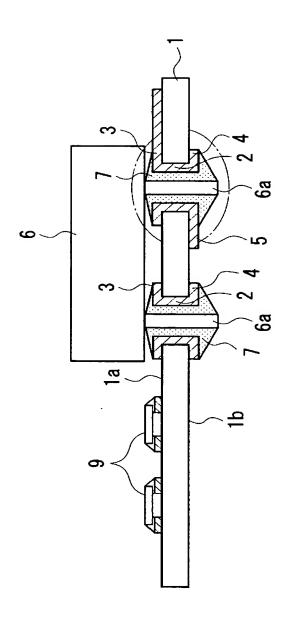
【図6】



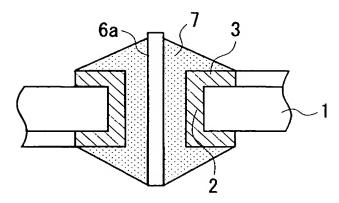
【図7】



【図8】

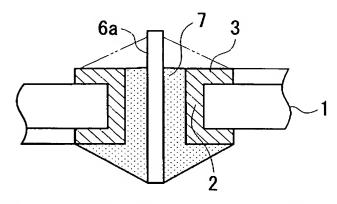


【図9】



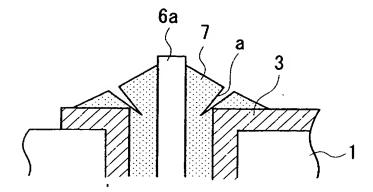
Sn/Pb共晶はんだのスルーホール上り例

【図10】



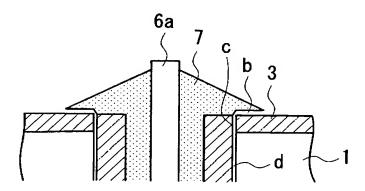
鉛フリーはんだでのスルーホール上り例

【図11】



Sn/Pb共晶はんだのクラック例

【図12】



鉛フリーはんだでのランド部の剥離等

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 融点とはんだ付け温度との間にわずかな温度差しか持たせることができない場合にあってもはんだ付け不良を低減する。

【解決手段】 プリント配線基板10に両面側に開口するスルーホール11を設け、スルーホール11に部品搭載面10a側より電子部品16のリード部16aを挿入し、リード部16aとスルーホール11との間をはんだ17を介して電気的に接続する電子部品16の実装構造において、プリント配線基板10には、スルーホール11の近傍に両面側に亘って貫通する熱伝導部材14を設け、この熱伝導部材14のはんだ浸漬面10b側の端部周囲には高い熱伝導性材料でなる集熱部15を設け、この集熱部15の部品搭載面10a側の端部を、部品搭載面10a側のスルーホール11近傍でこのスルーホール11に接続された配線部13に連続するように接続した。

【選択図】 図1



特願2002-356800

出願人履歴情報

識別番号

[000006895]

1. 変更年月日 [変更理由] 1990年 9月 6日

L 変 更 埋 田 」 住 所 新規登録 東京都港区三田1丁目4番28号

氏 名 矢崎総業株式会社